

研究论文

用小麦离体叶段鉴定抗白粉病性的方法

何文兰, 宋玉立, 张忠山, 何家泌

河南省农业科学院植物保护研究所, 河南郑州, 450002

收稿日期 1998-7-12 修回日期 1999-9-11 网络版发布日期 接受日期

摘要

关键词

分类号

Method for Testing Wheat Resistance to Powdery Mildew(*Blumeria graminis* s(DC)Speer)Using Wheat Detached-leaf-segment

He Wenlan, Song Yuli, Zhang Zhongshan, He Jiabi

Institute of Plant Protection, Henan Academy of Agricultural Sciences, Zhenzhou 450002

Abstract

Key words

DOI:

通讯作者 何文兰

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF\(196KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [复制索引](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 无 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [何文兰](#)

· [宋玉立](#)

· [张忠山](#)

· [何家泌](#)